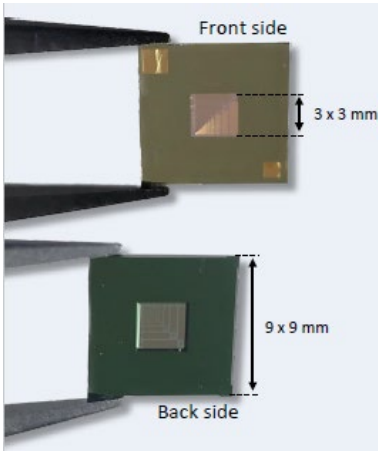
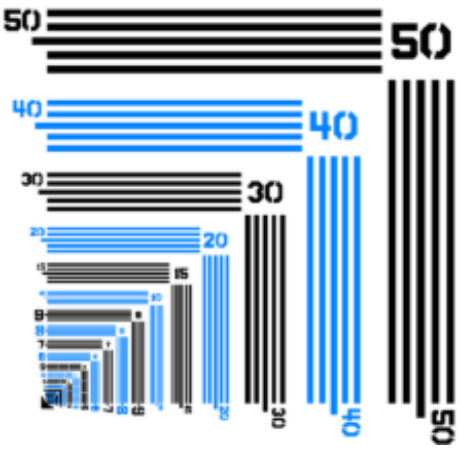
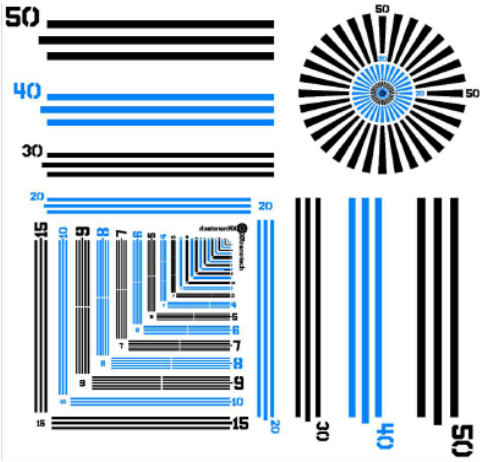
显微CT分辨率测试卡/MicroCT Resolution Test Target



测试卡硅片示意图（未装配支架）



设计1（200nm-50μm）



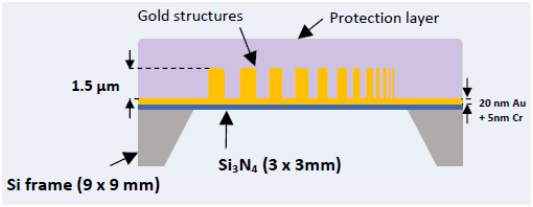
设计2（200nm-50μm）

新一代显微CT分辨率测试卡：提升您的 X 射线成像体验！我们尖端的测试卡通过融合现代微纳米制造技术（包括顶级电子束光刻技术）精心设计、制造而成。创新的测试图案展示了从 50μm 到 200nm 的线条和空间，以及西门子星图形。我们的标准产品旨在超越预期。对于寻求量身定制解决方案的客户，我们还提供完全可定制的选项。

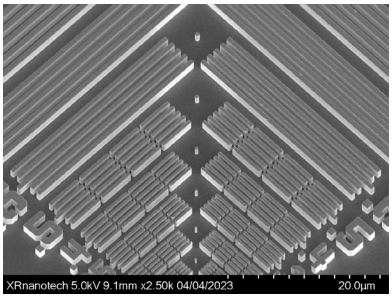
主要参数：

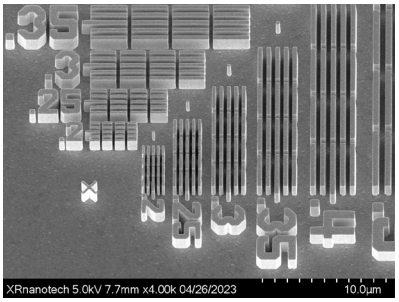
- 高衬度材料: 4 /1.5/1μm 金可选
- 超宽的测试范围：0.2-50μm含26中线对
- 紧凑的设计：含或不含西门子星图案
- 深度的SEM测试：保证出货前每片测试，以保证测试精度
- 保护层：5μm厚聚合物，以增强机械强度和寿命
- 快递交付：大量库存
- 质量保证：每年交付数百片

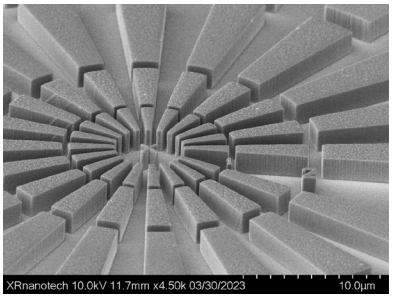
横截面图：



出厂深度的SEM测试示例：









含支架实物

Characterization certificate			
Size	Target width (μm)	CD (μm)	Dev
1	0.2	**0.206**	3.0%
2	0.25	**0.246**	1.6%
3	0.3	**0.295**	1.7%
4	0.35	**0.350**	0.0%
5	0.4	**0.399**	0.3%
6	0.5	**0.502**	0.4%
7	0.6	**0.605**	0.8%
8	0.7	**0.701**	0.1%
9	0.8	**0.825**	3.1%
10	0.9	**0.905**	0.6%
11	1	**1.010**	1.0%
12	1.5	**1.480**	1.3%
13	2	**2.060**	3.0%
14	3	**3.010**	0.3%
15	4	**4.070**	1.8%
16	5	**5.000**	0.0%
17	6	**6.090**	1.5%
18	7	**6.950**	0.7%
19	8	**8.060**	0.8%
20	9	**9.050**	0.6%
21	10	**9.870**	1.3%
22	15	**14.900**	0.7%
23	20	**19.700**	1.5%
24	30	**29.800**	0.7%
25	40	**39.900**	0.3%
26	50	**50.000**	0.0%
Averaged Deviation			1.0%
SEM tool : **Hitachi Regulus 8230**			

SEM实测线宽及标准方差

XRnanotech是瑞士领先的高质量x射线光学元件制造商，从具有破纪录分辨率的高纵横比菲涅耳带片到超稳定的钻石光学元件和用于广泛x射线应用的定制3d纳米结构。众星联恒联合**XRnanotech**，为中国用户提供所有售前咨询，销售及售后服务，欢迎联系我们。

参考文献：

1. Dreier T, Krüger R, Bernström G, et al. Laboratory x-ray nano-computed tomography for biomedical research[J]. Journal of Instrumentation, 2024, 19(10): P10021.

2. Plappert D, Schütz M, Ganzenmüller G C, et al. An Open-Frame Loading Stage for High-Resolution X-Ray CT[J]. Instruments, 2024, 8(4): 52.

请联系我们
北京众星联恒科技有限公司

北京市海淀区信息路1号_1-2号楼B栋　　电话：+86-10-86467571　　邮箱:sales@top-unistar.com